



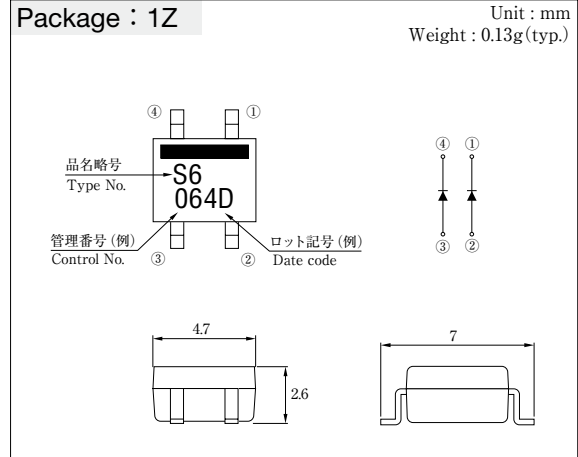
特長

- SMD
- ツイン
- 耐湿性に優れ高信頼性

Feature

- SMD
- Twin-Di
- High-Reliability

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

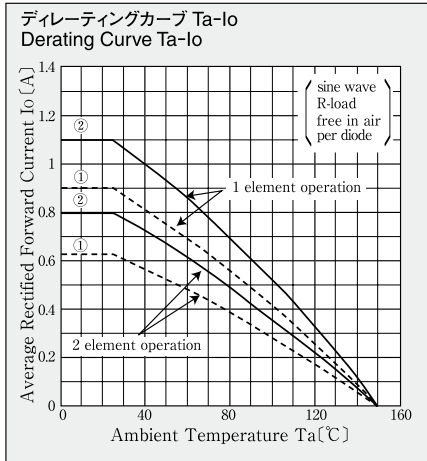
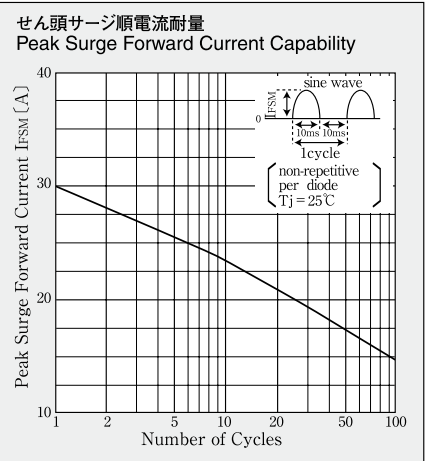
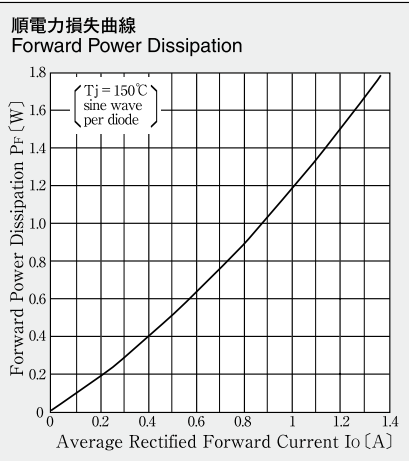
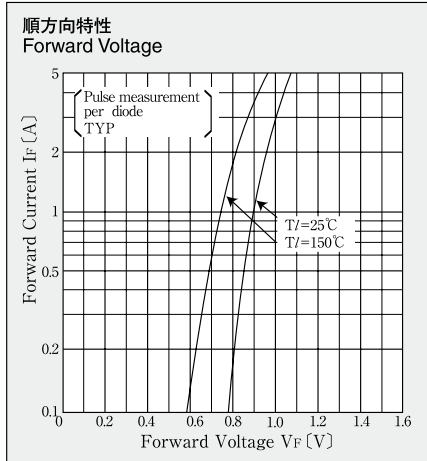
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZA20	S1ZA60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150		°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25°C 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=25°C	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	1.1	A
				2回路通電 2 element operation	0.8 *	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	0.9	
				2回路通電 2 element operation	0.63 *	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25°C		30 *		A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZA20	S1ZA60	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 0.9A, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 1.1		V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10		μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 93	°C/W
				2回路通電 2 element operation	MAX 140 *	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 120	
				2回路通電 2 element operation	MAX 186 *	

* : 1素子当たりの規格値 * : per diode

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



	①プリント基板実装 on glass-epoxy substrate	②アルミナ 基板実装 on alumina substrate
プリントランド soldering land	1mm □	1mm □
導体箔 conductor layer	35 μm	20 μm
基板の厚さ substrate thickness	—	0.64 t

* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.